

S&A

W-2200B ディスクパレット デュアルチャンバー温度テストシステム 250B-1または250Cネットワークアナライザーとセット

- 自動化されたソフトウェアベースの水晶振動子温度テストシステムです。
- 一度のテストで1280デバイスを継続してテスト可能です。

利用可能な標準サイズ:

タイプ	ディスク内の収容数	トータルチャンバー内の収容数
SMD 5 x 7mm	140	560
SMD 4.5 x 8mm	140	560
SMD 3.5 x 6mm	160	640
SMD 3.2 x 5mm	160	640
SMD 2.5 x 4mm	160	640
SMD HC-49USMD	100	400
リードタイプ HC-45/49	100	400

- SMDのカスタムサイズも利用可能です。
- チャンバーカバー内部に搭載された高速ファンは、より速い浸漬(シンシ)温度タイムを提供します。
- ディスクパレットは、SMDデバイスの配置/取り外しを自動的に行うS&A 901Aマシンとの結合が非常に容易です。



- 75以上の異なるパラメータで測定可能です。
- パラメータとカーブフィット特性は、品質管理(QC)の制限を定義することが容易です。
- 異なる周波数の水晶振動子を一回の温度テスト内でテストが可能です。
- 全てのデータは、Microsoft Access™ データベースで公開され、カスタムデータ解析のために Microsoft Excel™ にエクスポートが可能です。
- Crystal Reports® を使用した印刷が可能です。

仕様

250B-1周波数帯:	15KHzから220MHz
250C 周波数帯:	15KHzから500MHz
周波数相関性:	直列共振にての典型値* ± 1 ppm
水晶パワー:	1 nWから1000uW (1 MHzから50MHz) 1 nWから500uW (50MHz以上から200MHz)
温度範囲 (周囲の温度):	標準仕様: -55 から+155 (オプションで200) LN ₂ 仕様: -65 から+150 (オプションで200)
温度の安定度:	± 0.1
処理能力の例:	5箇所の温度ポイント(-25 0 25 50 85)において 1時間で1200パーツ

* 弊社計測法及び計測アルゴリズムは、業界基準水晶計測装置に相関性を提供します。

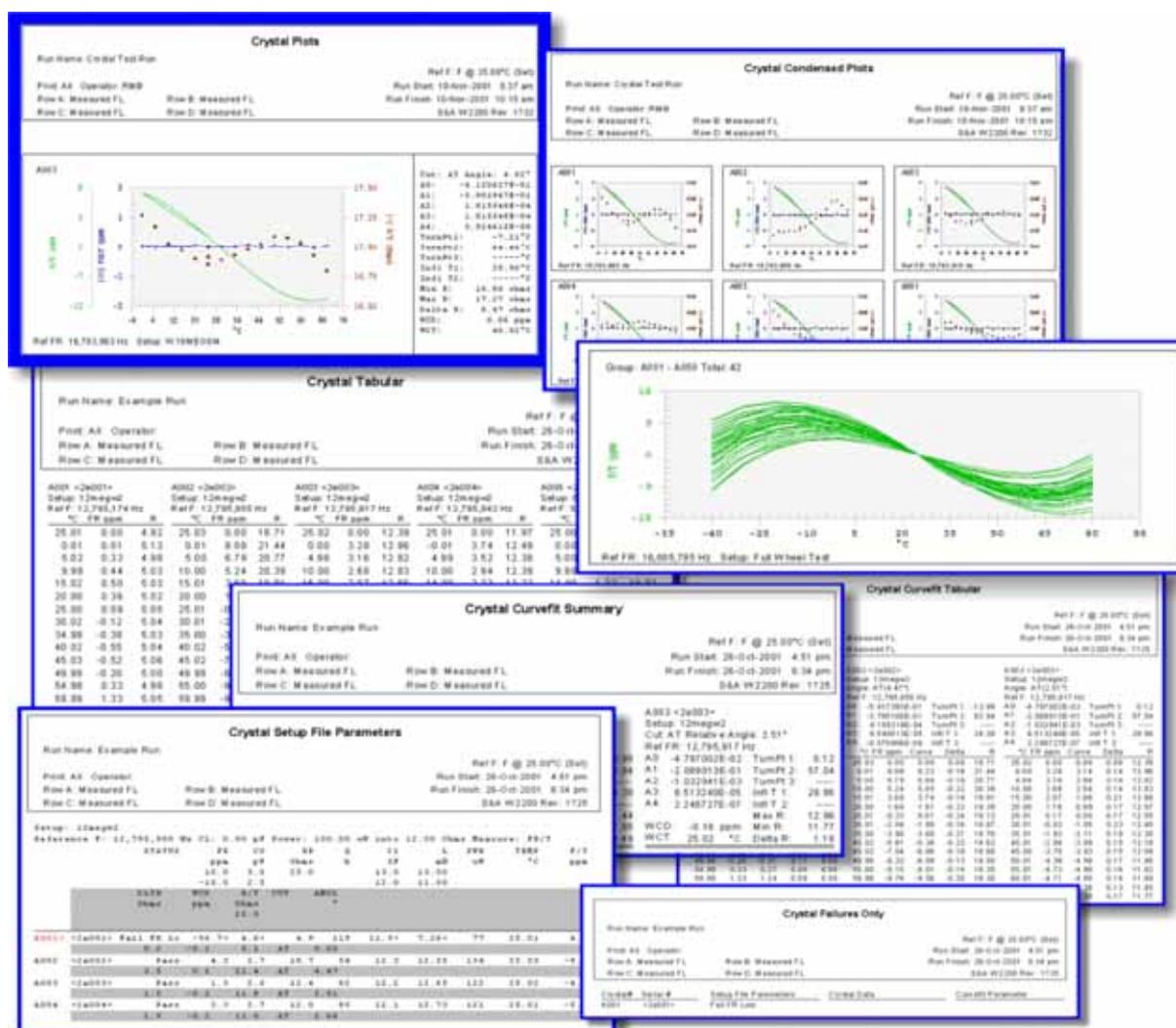
サンダースジャパン株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル3F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774
E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web <http://www.Saunders-Assoc.co.jp>

システム構成

- 250B-1または250Cネットワークアナライザ
- S&A 2451 スイッチコントローラ × 2
- S&A 4220 温度テストチャンバー × 2
(LCO₂, LN₂, またはメカニカル冷却制御)
- IEC-444規格のPi ネットワークテストヘッド
- Windows® ベースのシステムソフトウェア
- プリンター (オプション)
- パソコンの要求スペック:
CPU: 500 MHz Pentium III以上の処理速度
フルサイズ及びショートサイズのPCIスロット × 各1
(+3.3V & 5Vの電力が必須)
OS : Windows XP®

サンプルレポート



サンダースジャパン株式会社